

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年11月27日 (2014.11.27)

【公開番号】特開2012-160748(P2012-160748A)

【公開日】平成24年8月23日 (2012.8.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-033

【出願番号】特願2012-73492(P2012-73492)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/822 (2006.01)

H 0 1 L 27/04 (2006.01)

H 0 1 L 29/12 (2006.01)

H 0 1 L 29/78 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/861 (2006.01)

H 0 1 L 29/868 (2006.01)

H 0 1 L 21/329 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 27/04 C

H 0 1 L 29/78 6 5 2 T

H 0 1 L 29/78 6 5 2 K

H 0 1 L 29/78 6 5 8 F

H 0 1 L 29/78 3 0 1 B

H 0 1 L 29/91 F

H 0 1 L 29/91 D

H 0 1 L 29/91 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年10月10日 (2014.10.10)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 6 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【 0 0 6 7 】

図 1 3 は、従来の誘電体として窒化ケイ素膜のみを有するコンデンサ（線 1 1 2）、厚みが 3 0 n m の二酸化ケイ素層および厚みが 3 0 0 n m の窒化ケイ素層を有する、本発明の実施形態によるコンデンサ（線 1 1 0）、厚みが 3 0 n m の二酸化ケイ素層および厚み 2 4 0 n m の窒化ケイ素層を有するコンデンサ（線 1 1 4）、および厚みが 3 5 0 n m の酸窒化ケイ素層を有するコンデンサ（線 1 1 6）についての、ストレス電圧対平均故障寿命のグラフを示す図である。平均故障寿命は、素子を種々のストレス電圧で試験し、素子の固有の欠陥（すなわち、外因的欠陥による故障以外のすべての故障）の結果として故障寿命の平均を求めることによって導いた。この平均が図 1 3 に示すデータ点としてプロットされた。平均故障寿命線は、プロットされた点から外挿された。図 1 3 に見られるように、本発明の実施形態によるコンデンサについての平均故障寿命線 1 1 0 は、グラフ上で、従来の窒化ケイ素膜のみの素子についての平均故障寿命線より高いところに移っているだけでなく、従来の窒化ケイ素膜のみの素子についての線より大きな傾斜も有している。したがって、従来の窒化ケイ素膜のみの素子に比べて、本発明を用いる利益が、動作電圧が下がるにつれて増す可能性がある。